## Повреждение микросхем при пробивании толстостенной преграды потоком высокоскоростных микрочастиц

Магистрант гр. 50424022 Филиппов М.Н. Научный руководитель – Ушеренко С.М. Белорусский национальный технический университет г. Минск

Суть эффекта сверхглубокого проникания (СГП) заключается во внедрении (проникании) материала частиц из их высокоскоростного потока, соударяющегося с металлической преградой, на аномально большую глубину, составляющую величину  $10^2$ - $10^4$  исходного размера частиц, что составляет десятки и сотни миллиметров [1, 2]. В толщине преграды фиксируются следы — треки, представляющие собой схлопнувшиеся или частично схлопнувшиеся каналы, оставляемые проникшим материалом частиц, которые выявляются химическим или электрохимическим травлением образца. Анализ полученных изображений вытравленных треков показал, что все они имеют диаметр в десятки и сотни раз меньше диаметра исходной (метаемой) частицы. Проведенные исследования на проницаемость тонких ( $\leq 0,5$  mm) пластинок-срезов, вырезанных из преграды, обработанной потоком частиц перпендикулярно поверхности образца, ее не зарегистрировали, т. е. в материале преграды, после проникания в него частиц, не образуется сквозной пористости. Эти установленные факты — глубина и диаметр вытравливаемого канала относительно исходного размера частицы и отсутствие сквозной пористости являются основными, принципиальными отличия ми аномального проникания (СГП) от внедрения отдельной скоростной частицы в преграду.

При соударении в режиме СГП (для микрочастиц карбида кремния это экспериментально определенные основные параметры потока, такие как средняя  $\rho = 2$  g/cm<sup>3</sup>, скорость соударения от 900 до 300 m/s, изменяющаяся со временем процесса, которое длится 200 µs [3]) потока микрочастиц с преградой, имеющей толщину меньше предельной глубины проникания, происходит ее пробитие и выход с тыльной стороны материала частиц и самой преграды. На рисунке 1 представлены обнаруженные с использованием сканирующего электронного микроскопа следы пробивания фольг из пластика (гибкие компьютерные дискеты  $5\frac{1}{2}''$  толщиной 80 µm), которые использовались в качестве детекторов и размещались за преградой.





Рисунок 1 – След взаимодействия материала частицы SiC при проникании ее за стальную преграду: а – толщиной 200 mm со 2-й фольгой из пакета в 30 шт.; b – толщиной 50 mm с 31-й фольгой из пакета в 40 шт.

Номер фольги указывает, какой по счету она располагалась в пакете, закладываемом за преградой вплотную к ее тыльной стороне, через тонкую бумажную кальку. Взаимодействия

ударников с фольгами могут быть различного вида [2]. Следы в виде включения содержат материал частиц потока и преграды в различном процентном соотношении. Закономерности соотношений содержания вышедшего материала частицы и преградына данном этапе проводимых исследований нами не установлено. В [2] обосновывается предположение, что выход материала частицы и преграды с тыльной стороны последней происходит в виде микроструи. Этим объясняется пробой пакета алюминиевых и медных фольг из 40 штук (толщина каждой фольги 10 µm) с оставлением следа пробивания значительно меньшего диаметра частиц потока.

В данной работе приводятся результаты исследования соударения потока микрочастиц в режиме СГП с преградой, имеющей толщину меньше максимальной глубины проникания, и последующего пробивания корпуса расположенной за преградой микросхемы, с воздействием на ее кристалл.

Формирование потока частиц осуществлялось обжатием продуктами детонации взрывчатого вещества кумулятивной линзы, заполненной порошковым материалом (микрочастицами Ni размером 10-40 µm) [1, 2]. Преграда представляла собой сборный контейнер [2] с лобовой стенкой толщиной 200 mm, внутри которого размещалась интегральная микросхема в металлокерамическом корпусе с осуществлением мер, предотвращающих ее удары о стенки контейнера в процессе взаимодействия последнего с потоком. До и после экспериментов измерялись все тестовые электрические параметры микросхемы.

После обработки преграды потоком микрочастиц на поверхности преграды образовались только микрократеры глубиной и диаметром меньше 3 mm. На извлеченных из контейнера корпусах микросхем не выявлено видимых механических повреждений. Измерения электрических параметров, тестирующих микросхему, показали, что от 40 до 60 % их общего количества изменились выше допустимых норм. Анализ на оптическом и сканирующем электронном микроскопе поверхности кристаллов микросхем после вскрытия их корпусов выявил на них появившиеся точечные включения (рисунок 2). Эти включения содержат химические элементы, которые присутствуют в составе крышки микросхемы и самом кристалле. Отметим, что и на обратной стороне крышки корпуса микросхемы также зарегистрированы появившиеся точечные следы темного цвета.



a)



Рисунок 2 – Изображение наблюдаемых включений на кристалле вскрытой микросхемы, полученное на: а – оптическом микроскопе ×200;

b - сканирующем электронном микроскопе ×2000.

Из приведенных экспериментальных результатов можно сделать следующие выводы и предположения:

– пробивание крышки корпуса микросхемы является дополнительным подтверждением

того, что выход материала микрочастицы и самой преграды происходит в виде микроструи с длиной не меньше толщины крышки (200 µm), так как пробивание ее невозможно ударником в виде отдельной частицы, имеющей диаметр, даже равный следу пробивания фольг (порядка нескольких микрометров);

– отсутствие каких-либо дополнительных воздействий и условий, которые могут принципиально изменить форму ударника (микроструи) при выходе из преграды и внедрении в фольгу (пробивания), предполагает, что проникающий ударник (материал частицы и преграды) в преграде также имеет вид микроструи;

– при определенных условиях соударения сгустка микрочастиц (микрометеоритов) (соотношения плотности, скорости и размера — осуществление режима СГП) в космическом пространстве с летательным аппаратом может происходить пробивание его корпуса и воздействие на элементы электронного оборудования, расположенные в непосредственной близости от корпуса. Это, как было показано, приведет к сбою и даже отказу в работе оборудования. Опасность такого соударения возрастает из-за наличия в околоземном пространстве большого количества разнообразного так называемого «космического мусора», являющегося побочным продуктом деятельности человека в космосе [4].

## Список использованных источников

1. Роман О.В., Андилевко С.К., Карпенко С.С. и др. Процессы в металлических материалах при сверхглубоком проникании частиц, разогнанных энергией взрыва – ИФЖ. 2002. Т. 75. № 4. С. 187–199.

2. Дыбов О.А., Романов Г.С., Ушеренко С.М. О проникании на большие глубины материала частиц из высокоскоростного потока при соударении со стальной преградой – ИФЖ. 2003. Т. 76. № 5. С. 8–9.

3. Дыбов О.А., Романов Г.С., Ушеренко С.М. Определение параметров потока частиц, соударяющихся с преградой – ИФЖ. 2004. Т. 77. № 1. С. 15–19.

4. Новиков Л.С. Инженерная экология. 1999. № 4. С. 10–19.